

新発売、縦型高分解能ラザフォード後方散乱分析装置の特徴と新機能

1、縦型構造による省スペースな設置面積、使い易さも各段と向上！

設置面積は当社従来比で30%、全長を50%に減少。機能も更に付加し操作性の容易さ、解析の精度を高めています。

2、角度自在変更機構採用（オプション）で分析角度を簡単に設定！

膜厚構造にあわせて真空を破らずに、最適な分析角度に調整可能な角度自在機構を開発。スペクトルを見ながら角度の微調整も可能となりました。

3、自動フィッティングソフトウェアによる簡単なシミュレーション！

独自開発の分析解析ソフトウェアにより、解析時間の短縮と自動フィット機能による解析作業の簡単化を実現。初心者でも直ぐに分析解析ができます。

4、取り扱いが容易な小型加速器搭載！

小型な加速に加え、低圧絶縁ガス（0.19MPa以下）を充填し取り扱いが一段と容易になりました。

高分解能ラザフォード後方散乱分析装置の基本特徴

1、驚異的分解能 最高20μストロム！

従来のRBSの分解能である100μストロムの1/50を実現。Si元素1個に相当する分解能であり従来のRBS、SIMS、AES等では分析困難な領域を非破壊で定量分析し、そして極薄膜の膜厚測定が出来ます。

2、チャリッジ測定及び水素（オプション）も高分解能で分析できます！

チャリッジを利用して結晶性の定量評価も高分解能で行えます。
また、他の分析手法では難しい、表面当面から数～数十nm領域の水素のディプロファイルを高分解能ERDA（オプション）により調べることができます。